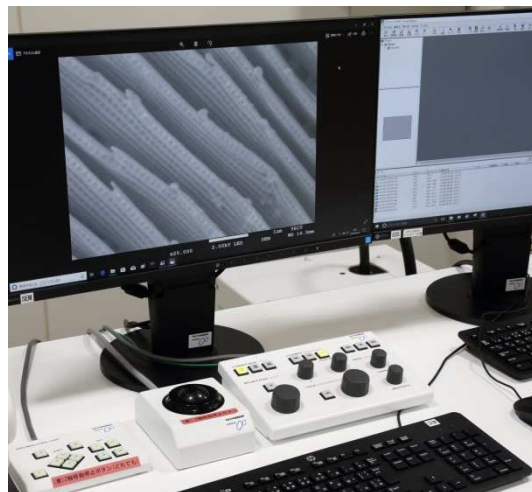


超高分解能走査型電子顕微鏡

【日本電子(株)製 JSM-7900F】 平成30年1月導入

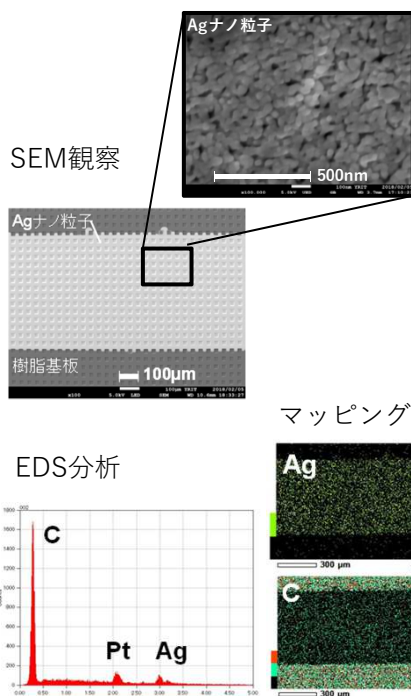


- 電子部品をはじめ各種材料、製品の表面を高倍率で観察できます。
- 観察部の成分(元素)を分析することができます(EDS)。
- 電子ビームによる損傷が懸念される試料も高分解能観察ができます。

仕様	
電子銃	インレンズショットキー電界放出形
分解能	0.7nm~3.0nm
倍率	×25 ~ ×1,000,000
加速電圧	0.01 ~ 30kV
分析対象	固体(飛散しやすい粉末は除きます) 例)電子部品,金属材料,セラミックス等
溶媒	不可(水や有機溶媒など揮発成分を含むものは装置に導入できません)
試料サイズ	最大 φ100mm、高さ40mm ※ステージ可動範囲 X70mmY50mmZ2~41mm傾斜:-5~70°
分析可能元素	ホウ素(5B)~ウラン(92U)
試料調製	絶縁体は導電コーティングが必要です。

使用方法	
	項目
委託分析試験	電界放出形走査電子顕微鏡写真、 EDS定性分析(固体、粉末)(電界放出形走査電子顕微鏡を用いたもの)
設備使用	電界放出形走査電子顕微鏡

* 料金は別途料金表をご確認ください。



樹脂基板上的Agナノ粒子の観察・分析例